

# BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



#4  
JCS41 U.S. PTO  
09/758675  
01/11/01

## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:** 100 00 785.6

**Anmeldetag:** 11. Januar 2000

**Anmelder/Inhaber:** ROBERT BOSCH GMBH,  
Stuttgart/DE

**Bezeichnung:** Verfahren zum Ansteuern einer JTAG-Schnitt-  
stelle eines Mikroprozessors eines Mikrocon-  
trollers auf dem eine JTAG-Schnittstelle imple-  
mentiert ist und Mikrocontroller

**IPC:** G 06 F 11/22

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-  
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 09. November 2000  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag

Seller

jc841 U.S. PRO  
09/758675

5 11.01.2000  
Robert Bosch GmbH , 70469 Stuttgart

10 Verfahren zum Ansteuern einer JTAG-Schnittstelle eines  
Mikroprozessors eines Mikrocontrollers auf dem eine JTAG-  
Schnittstelle implementiert ist und Mikrocontroller

Stand der Technik

15 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum  
Ansteuern eines Mikroprozessors, der Teil eines  
Mikrocontrollers ist, im Rahmen eines Boundary-Scan-  
Testverfahrens nach dem Institute-of-Electrical-and-  
20 Electronic-Engineers (IEEE)-Standard 1149 über eine Joint-  
European-Test-Action-Group (JTAG)-Schnittstelle des  
Mikroprozessors. Die Erfindung betrifft außerdem einen  
Mikrocontroller mit mindestens einem Mikroprozessor, der im  
Rahmen eines Boundary-Scan-Testverfahrens nach dem IEEE-  
25 Standard 1149 über eine JTAG-Schnittstelle des  
Mikroprozessors ansteuerbar ist.

Das Boundary-Scan-Testverfahren nach dem IEEE-Standard 1149  
ist seit einiger Zeit aus dem Stand der Technik bekannt.

30 Das Boundary-Scan-Testverfahren dient zur Prüfung der  
Verbindung zwischen zwei Halbleiterbauelementen, bspw.  
zwischen einem Mikrocontroller und externen Treibern des  
Mikrocontrollers. Der Boundary-Scan hat den Vorteil, dass  
auf die zu prüfenden elektronischen Halbleiterbauelemente  
35 nicht direkt bspw. mit Hilfe eines Meßtasters (z. B. eines  
Nagelbettadapters) von außen zugegriffen werden muß,  
sondern dass der Zugriff auf die elektronischen

Halbleiterbauelemente über die JTAG-Schnittstelle des Halbleiterelements erfolgt. Der Boundary-Scan wird im Stand der Technik ausführlich beschrieben, so bspw. in dem Informationspapier von SUN MICROELECTRONICS, Mountain View, CA, USA, "Introduction to JTAG Boundary-Scan", White Paper, January 1997, Part No. WPR-0018-01, und im Internet auf der Seite [http://www.iese.et.tu-dresden.de/iese/em/web\\_dot4.htm](http://www.iese.et.tu-dresden.de/iese/em/web_dot4.htm), "Analoges Boundary Scan, IEEE P1149.4". Auf beide Ausführungen wird ausdrücklich Bezug genommen.

Die vorliegende Erfindung betrifft insbesondere den Boundary-Scan bei als Mikroprozessoren ausgebildeten Halbleiterbauelementen. Die Mikroprozessoren sind Teil eines Mikrocontrollers, der wiederum Teil eines Steuergeräts für ein Kraftfahrzeug ist. Die Steuergeräte werden zum Steuern/Regeln bestimmter Funktionen eines Kraftfahrzeugs eingesetzt, bspw. der Brennkraftmaschine, der Bremsen, des Getriebes, des Fahrwerks, der Fahrdynamik oder der Heizung/Klimatisierung des Kraftfahrzeuginnenraums.

Nach dem Stand der Technik wird die JTAG-Schnittstelle über Pins kontaktiert. Über einen Hardware-Adapter eines JTAG-Testers, der an die JTAG-Schnittstelle angeschlossen wird, sind die Pins von außen beobachtbar und/oder steuerbar. Über den Hardware-Adapter wird der JTAG-Schnittstelle ein Testdatenstrom für den Mikrocontroller bzw. für den Mikroprozessor gemäß eines festgelegten Testablaufs des Boundary-Scan-Testverfahrens zur Verfügung gestellt. Somit muss die JTAG-Schnittstelle nach dem Stand der Technik zur Ausführung des Boundary-Scan-Testverfahrens von außen frei zugänglich sein, damit der Hardware-Adapter angeschlossen werden kann.

Für Mikrocontroller, die in einem Gehäuse angeordnet sind oder bei denen die JTAG-Schnittstelle im einsatzbereiten Zustand aus anderen Gründen nicht frei zugänglich ist, kommt der Einsatz des Boundary-Scan-Testverfahrens somit  
5 nicht in Betracht. So kann auch die Prüfung von Steuergeräten für Kraftfahrzeuge mit zum Teil komplexen Mikrocontrollern nach dem Stand der Technik nicht mittels des Boundary-Scan-Testverfahrens durchgeführt werden, da das Steuergerät im einsatzbereiten Zustand in einem Gehäuse  
10 eingeschlossen ist und eine Kontaktierung der JTAG-Schnittstelle mit einem Hardware-Adapter von außen nicht möglich ist. Zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit von Steuergeräten für Kraftfahrzeuge müssen nach dem Stand der Technik deshalb umfangreiche Funktionstests durchgeführt  
15 werden, die relativ zeitaufwendig und teuer sind.

Es ist deshalb eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren bzw. einen Mikrocontroller der eingangs genannten Art dahingehend auszugestalten und weiterzubilden, dass die  
20 ordnungsgemäße Funktion des Mikrocontrollers auch bei nicht frei zugänglicher JTAG-Schnittstelle des Mikroprozessors mit dem Boundary-Scan-Testverfahren überprüft werden kann.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfindung ausgehend von dem Verfahren der eingangs genannten Art vor, dass die  
25 JTAG-Schnittstelle des Mikroprozessors von einer auf dem Mikroprozessor ablauffähigen Testroutine aus angesteuert wird.

30 Vorteile der Erfindung

Gemäß der vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, die JTAG-Schnittstelle nicht über einen separaten Hardware-Adapter eines JTAG-Testers anzusteuern, sondern in dem

Mikroprozessor eine besondere Testroutine vorzusehen, durch die die JTAG-Schnittstelle im Rahmen eines Boundary-Scan-Testverfahrens angesteuert werden kann. Erfindungsgemäß wird also vorgeschlagen, die Funktion eines JTAG-Testers durch die Testroutine zu emulieren und die Testroutine zur Durchführung des Boundary-Scan-Testverfahrens auf dem Mikroprozessor auszuführen.

Die Testroutine wird bei Bedarf zu Testzwecken aufgerufen. Zur Ausführung der Routine wird der Mikrocontroller in einen JTAG-Testmodus umgeschaltet. Die Testroutine ist in einem internen oder externen Speicher des Mikroprozessors abgelegt und wird in dem Testmodus in den internen Programmspeicher (z. B. ein Random-Access-Memory, RAM) des Mikroprozessors kopiert. Alternativ kann die Testroutine auch in einem internen Flash-Speicher des Mikroprozessors abgelegt sein, wo sie im Testmodus direkt ausgeführt werden kann. Die Routine enthält Steuerbefehle zur Ansteuerung der Pins der JTAG-Schnittstelle und Testdaten, die über die JTAG-Schnittstelle an den Mikroprozessor bzw. an den Mikrocontroller übermittelt werden. Nach dem Ende des Boundary-Scan-Testverfahrens wird der JTAG-Testmodus des Mikrocontrollers beendet. Dazu wird vorzugsweise der Reset (RST)-Eingang der JTAG-Schnittstelle gesetzt.

Der Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, dass eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit eines Mikrocontrollers auch dann durchgeführt werden kann, wenn die JTAG-Schnittstelle des Mikroprozessors von außen nicht frei zugänglich ist. Das ist bspw. bei der Prüfung von Steuergeräten mit komplexen Mikrocontrollern wichtig, wie sie bspw. zur Steuerung/Regelung bestimmter Funktionen in einem Kraftfahrzeug eingesetzt werden. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kann ohne umfangreiche

Funktionstests die ordnungsgemäße Funktion eines Steuergeräts geprüft werden. Insbesondere können die Verbindungen von dem Mikrocontroller des Steuergeräts zu externen Treibern überprüft werden. Mit dem nunmehr bei  
5 Steuergeräten durchführbaren Boundary-Scan-Testverfahren lässt sich eine wesentlich höhere Testabdeckung erzielen. Außerdem führt das erfindungsgemäße Verfahren zu einer Verkürzung der Testzeit, da bestimmte Funktionstests von dem Boundary-Scan-Testverfahren ersetzt werden und deshalb  
10 entfallen können.

Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, dass Input-Output (IO)-Ports des Mikroprozessors mit den Pins der JTAG-Schnittstelle  
15 verbunden werden und die Pins der JTAG-Schnittstelle von der Testroutine über die IO-Ports angesteuert werden. Die IO-Ports des Mikroprozessors sind bspw. als Padzellen mit einer IO-Port-Funktion ausgebildet. Die Padzellen dienen dem Mikroprozessor als Eingangsinverter oder als  
20 Ausgangstreiber.

Die IO-Ports des Mikroprozessors können durch entsprechende Steuerbefehle der Testroutine zwischen einem Input-Mode und einem Output-Mode umgeschaltet werden. Wenn die Padzellen  
25 im Input-Mode geschaltet sind, sind sie mit Ausgangspins (z. B. Data Out (DO)) der JTAG-Schnittstelle verbunden und können an den Pins anliegende Werte erfassen. Wenn die Padzellen im Output-Mode geschaltet sind, sind sie mit Eingangspins (z. B. Data In (DI)) der JTAG-Schnittstelle  
30 verbunden und es können Testdaten über die Pins an den Mikroprozessor bzw. an den Mikrocontroller übermittelt werden. Diese Art der Ansteuerung der Pins der JTAG-Schnittstelle als IO-Ports stellt eine besonders einfache Implementierung dar. Es sind jedoch eine Vielzahl anderer

Implementierungen zur Ansteuerung der Pins der JTAG-Schnittstelle aus einer auf dem Mikroprozessor ablauffähigen Testroutine heraus denkbar.

5 Die Pins der JTAG-Schnittstelle werden vorteilhafterweise  
von der Testroutine gemäß eines in der Testroutine  
festgelegten Testablaufs gesetzt und/oder gelesen. Über die  
IO-Ports, die als Ausgänge geschaltet sind, kann ein  
vorgegebener Testdatenstrom über die JTAG-Schnittstelle an  
10 den Mikroprozessor bzw. an den Mikrocontroller übertragen  
werden. An den Pins einer Schnittstelle des  
Mikrocontrollers, auf die bspw. mittels eines Testadapters  
von außen zugegriffen werden kann, können dann die  
anliegenden Pegel gemessen werden. Die an diesen Pins der  
15 Schnittstelle des Mikrocontrollers anliegenden Pegel sind  
abhängig von dem Testdatenstrom, der von der Testroutine  
über die Pins (DI) der JTAG-Schnittstelle auf den  
Mikroprozessor bzw. den Mikrocontroller gegeben wird, und  
von der Funktionsfähigkeit des Mikrocontrollers.  
20  
Über die IO-Ports, die als Eingänge geschaltet sind, können  
die an den Pins der JTAG-Schnittstelle anliegenden Werte  
gelesen werden. Die gelesenen Werte können entweder sofort  
weiterverarbeitet oder für eine spätere Verarbeitung  
25 zunächst zwischengespeichert werden. Wenn zumindest einer  
der IO-Ports als Eingang geschaltet ist, können durch den  
Testadapter über die Schnittstelle des Mikrocontrollers  
bestimmte Werte an den Mikrocontroller bzw. an den  
Mikroprozessor angelegt werden. Die an den Pins (DO) der  
30 JTAG-Schnittstelle anliegenden Werte sind abhängig von den  
an der Schnittstelle des Mikrocontrollers anliegenden  
Werten und der Funktionsfähigkeit des Mikrocontrollers.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden

Erfindung wird vorgeschlagen, dass von der Testroutine im Rahmen des Boundary-Scan-Testverfahrens ein Testdatenstrom für die JTAG-Schnittstelle zur Verfügung gestellt wird. Mit Hilfe des Testdatenstroms können bestimmte Testdatenmuster an den Mikroprozessor bzw. an den Mikrocontroller angelegt werden, um dadurch bestimmte Funktionen des Mikrocontrollers zu simulieren und die Funktionsfähigkeit des Mikrocontrollers zu überprüfen.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, dass die IO-Ports des Mikroprozessors von der Testroutine für eine vorgegebene Zeitdauer als Output-Ports und auf High geschaltet werden, wobei an einer Schnittstelle des Mikrocontrollers anliegenden Pegel gemessen werden. Die Schnittstelle des Mikrocontrollers ist bspw. als eine Scalable-Coherent-Interface (SCI)-Schnittstelle ausgebildet. Die an der Schnittstelle des Mikrocontrollers anliegenden Pegel werden bspw. mit Hilfe eines Testadapters gemessen.

Des weiteren wird vorgeschlagen, dass die I/O-Ports des Mikroprozessors von der Testroutine für eine vorgegebene Zeitdauer als Input-Ports geschaltet werden, wobei gemäß des festgelegten Testablaufs bestimmte Werte an einer Schnittstelle des Mikrocontrollers angelegt werden. Die Werte werden bspw. mittels eines Testadapters an die Schnittstelle des Mikrocontrollers angelegt. An den Pins (DO) der JTAG-Schnittstelle werden in Abhängigkeit von den an der Schnittstelle des Mikrocontrollers anliegenden Werten bestimmte Werte ausgegeben, die von dem als Input-Port geschalteten und mit den Pins der JTAG-Schnittstelle verbundenen I/O-Port des Mikroprozessors gelesen werden.



Die an den Pins der JTAG-Schnittstelle anliegenden Werte werden vorteilhafterweise über die I/O-Ports des Mikroprozessors gelesen und in einem Speicherbereich des Mikrocontrollers abgelegt. Der Speicherbereich ist bspw.  
5 ein interner Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (Random Access Memory, RAM) des Mikroprozessors. Im Anschluß an das Boundary-Scan-Verfahren werden die in dem Speicherbereich abgelegten Werte vorzugsweise über die Schnittstelle des Mikrocontrollers ausgelesen. Die  
10 ausgelesenen Werte können dann in einem Testgerät weiterverarbeitet werden.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, dass das erfindungsgemäße  
15 Verfahren zur Überprüfung des Mikrocontrollers eines Steuergeräts für ein Kraftfahrzeug verwendet wird.

Als eine weitere Lösung der Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird ausgehend von dem Mikrocontroller der eingangs genannten Art vorgeschlagen, dass mindestens ein  
20 Mikroprozessor Mittel zum Ansteuern der JTAG-Schnittstelle des Mikroprozessors durch eine auf dem Mikroprozessor ablauffähige Testroutine aufweist. Dadurch kann mittels einer einfachen Modifikation der JTAG-Schnittstelle des  
25 Mikroprozessors das Boundary-Scan-Testverfahren auch für solche Mikrocontroller eingesetzt werden, bei denen die JTAG-Schnittstelle von außen nicht frei zugänglich ist.

Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, dass die Mittel Padzellen des  
30 Mikroprozessors und Verbindungsleitungen von den Padzellen zu den Pins der JTAG-Schnittstelle umfassen, wobei die Padzellen eine Input-Output (IO)-Port-Funktion aufweisen. Die Padzellen dienen dem Mikroprozessor als

Eingangsinverter oder als Ausgangstreiber. Die Padzellen sind jeweils mit bestimmten Pins der JTAG-Schnittstelle verbunden. Durch Schalten der Padzellen als Input-Ports können an den Pins der JTAG-Schnittstelle anliegende Werte  
5 gelesen und durch Schalten als Output-Ports können an die Pins der JTAG-Schnittstelle bestimmte Werte angelegt werden.

10 Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, dass der Mikrocontroller eine Schnittstelle aufweist, an der von außerhalb des Mikrocontrollers die anliegenden Pegel messbar bzw. bestimmte Werte anlegbar sind. Die Schnittstelle des Mikrocontrollers ist vorzugsweise als eine Scalable-  
15 Coherent-Interface (SCI)-Schnittstelle ausgebildet ist.

#### Zeichnungen

20 Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung wird im Folgenden anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

25 **Figur 1** einen Mikroprozessor eines erfindungsgemäßen Mikrocontrollers gemäß einer bevorzugten Ausführungsform; und

**Figur 2** ein Ablaufdiagramm eines erfindungsgemäßen Verfahrens gemäß einer bevorzugten Ausführungsform.

#### Beschreibung der Ausführungsbeispiele

30 In Figur 1 ist ein Mikroprozessor eines erfindungsgemäßen Mikrocontrollers in seiner Gesamtheit mit dem Bezugszeichen

1 gekennzeichnet. Der Mikroprozessor 1 ist eines von vielen elektronischen Halbleiterbauelementen des Mikrocontrollers. Der Mikrocontroller ist Bestandteil eines Steuergeräts für ein Kraftfahrzeug. Das Steuergerät steuert bzw. regelt  
5 bestimmte Kraftfahrzeugfunktionen, bspw. die Brennkraftmaschine, das Getriebe, die Bremsen, das Fahrwerk, die Fahrdynamik oder die Heizung/Klimatisierung des Kraftfahrzeuginnenraums. Steuergeräte weisen in zunehmendem Maße komplexe Mikrocontroller auf, deren  
10 Funktionsfähigkeit nach dem Stand der Technik mit Hilfe immer mehr und immer umfangreicheren Funktionstests überprüft werden muß.

Zwar besitzen Mikroprozessoren in hochintegrierten  
15 Mikrocontrollern in zunehmendem Maße eine Joint-European-Test-Action-Group (JTAG)-Schnittstelle, über die im Rahmen eines Boundary-Scan-Testverfahrens nach dem Institute-of-Electrical-and-Electronic-Engineers (IEEE)-Standard 1149 die Funktionsfähigkeit des Mikrocontrollers überprüft  
20 werden kann. Allerdings sind Steuergeräte in einsatzbereitem Zustand in einem Gehäuse angeordnet. Deshalb ist die JTAG-Schnittstelle bei Mikroprozessoren von Steuergeräten von außen nicht frei zugänglich, so dass ein Hardware-Adapter eines JTAG-Testers zur Durchführung des  
25 Boundary-Scan-Testverfahrens nicht angeschlossen werden kann.

Aus diesem Grund schlägt die Erfindung ein besonderes Verfahren zum Ansteuern des Mikroprozessors 1 vor. Die  
30 JTAG-Schnittstelle des Mikroprozessors 1 ist in Figur 1 mit dem Bezugszeichen 2 gekennzeichnet. Die JTAG-Schnittstelle 2 wird über Pins 3 kontaktiert. An den Pins 3 wird nach dem Stand der Technik der Hardware-Adapter (nicht dargestellt) eines JTAG-Testers angeschlossen.

Um die Vorteile des Boundary-Scan-Testverfahrens auch bei einem Steuergerät für ein Kraftfahrzeug nutzen zu können, schlägt die Erfindung eine Modifikation des Mikroprozessors 1 vor, so dass die JTAG-Schnittstelle 2 von einer auf dem Mikroprozessor 1 ablauffähigen Testroutine aus angesteuert werden kann.

Der Mikroprozessor 1 weist Padzellen 4 auf, die eine normale Input-Output (IO)-Port-Funktion aufweisen. Die Padzellen 4 dienen dem Mikroprozessor 1 als Eingangsinverter oder als Ausgangstreiber. Die Padzellen 4 können durch die auf dem Mikroprozessor 1 ablauffähige Testroutine als Input-Port oder als Output-Ports geschaltet werden. Von bestimmten Padzellen 4a des Mikroprozessors 1 verlaufen Verbindungsleitungen 5 zu den Pins 3 der JTAG-Schnittstelle 2. Über die Verbindungsleitungen 5 wird ein Testdatenstrom von den Padzellen 4a an die Pins 3 (Test Data In, TDI) der JTAG-Schnittstelle 2 übertragen. Ebenso können über die Verbindungsleitungen 5 die an den Pins 3 (Test Data Out, TDO) der JTAG-Schnittstelle 2 anliegenden Werte von den Padzellen 4a eingelesen werden.

Die Pins 3 der JTAG-Schnittstelle 2 können von der Testroutine gemäß eines in der Testroutine festgelegten Testablaufs gesetzt und/oder gelesen werden. Über die Padzellen 4a, die als Ausgänge geschaltet sind, kann ein vorgegebener Testdatenstrom über die JTAG-Schnittstelle 2 an den Mikroprozessor 1 bzw. an den Mikrocontroller übertragen werden. An den Pins einer Schnittstelle (nicht dargestellt) des Mikrocontrollers, auf die bspw. mittels eines Testadapters (nicht dargestellt) von außen zugegriffen werden kann, können dann die anliegenden Pegel gemessen werden. Die an diesen Pins der Schnittstelle des

Mikrocontrollers anliegenden Pegel sind abhängig von dem Testdatenstrom, der von der Testroutine über die Pins 3 (TDI) der JTAG-Schnittstelle 2 auf den Mikroprozessor 1 bzw. den Mikrocontroller gegeben wird, und von der Funktionsfähigkeit des Mikrocontrollers.

Über die Padzellen 4a, die als Eingänge geschaltet sind, können die an den Pins 3 der JTAG-Schnittstelle 2 anliegenden Werte gelesen werden. Die gelesenen Werte können entweder sofort weiterverarbeitet oder für eine spätere Verarbeitung zunächst zwischengespeichert werden. Wenn zumindest eine der Padzellen 4a als Eingang geschaltet ist, können durch den Testadapter über die Schnittstelle des Mikrocontrollers bestimmte Werte an den Mikrocontroller bzw. an den Mikroprozessor 1 angelegt werden. Die an den Pins 3 (DO) der JTAG-Schnittstelle 2 anliegenden Werte sind abhängig von den an der Schnittstelle des Mikrocontrollers anliegenden Werten und der Funktionsfähigkeit des Mikrocontrollers.

Durch den Einsatz des Boundary-Scan-Testverfahrens kann eine höhere Testabdeckung bei der Steuergerät-Fertigung (Qualitätsverbesserung) erreicht werden. Außerdem ist eine Verkürzung der Testzeit möglich (Kosteneinsparung), da einige Funktionstests, die bisher zur Funktionsprüfung der Steuergeräte ausgeführt werden mußten, durch das Boundary-Scan-Testverfahren ersetzt werden und somit entfallen können.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird nun anhand des Ablaufdiagramms aus Figur 2 näher erläutert. Das Verfahren beginnt in einem Funktionsblock 10. Zu Beginn des Testverfahrens wird der Mikrocontroller in einen JTAG-Testmodus versetzt. Die Testroutine zur Ansteuerung der

JTAG-Schnittstelle 2 befindet sich in einem internen oder externen Speicher 11 des Mikroprozessors 1. In einem Funktionsblock 12 wird die Testroutine aus dem Speicher 11 in einen Flash-Speicher des Mikroprozessors 1 zur Ausführung geladen.

Im Rahmen der Ausführung der Testroutine in dem Mikroprozessor 1 werden in einem Funktionsblock 13 zunächst die Padzellen 4a in Abhängigkeit von dem Testablauf des Boundary-Scan-Verfahrens als Input-Ports und/oder als Output-Ports angesteuert. Im Funktionsblock 14 wird über die Padzellen 4a ein bestimmter Testdatenstrom an die Pins 3 der JTAG-Schnittstelle 2 angelegt. Dieser Testdatenstrom wird vorzugsweise an die Pins des Steuergerätes angelegt. Der Testdatenstrom ist ebenfalls abhängig von dem Testablauf des Boundary-Scan-Testverfahrens. Mit Hilfe des Testdatenstroms können unterschiedliche Testdatenmuster an den Mikroprozessor 1 bzw. an den Mikrocontroller angelegt werden. Weiterhin ist es möglich, auch weitere Chips (CICs) mit JTAG-Funktionalität mit dem Mikrocontroller zu verbinden (und zu testen.)

In einem Funktionsblock 15 werden bestimmte Werte an die Pins der Schnittstelle des Mikrocontrollers angelegt, falls die Padzellen 4a als Input-Ports angesteuert sind. Dann werden die an den Pins 3 der JTAG-Schnittstelle anliegenden Werte über die Padzellen 4a in den Mikroprozessor 1 gelesen. Falls die Padzellen 4a als Output-Port angesteuert sind, werden in dem Funktionsblock 15 bestimmte Werte an die Pins 3 der JTAG-Schnittstelle 2 angelegt. Dann werden die an den Pins der Schnittstelle des Mikrocontrollers anliegenden Pegel gelesen.

Das Anlegen bestimmter Werte an die Schnittstelle des

Mikrocontrollers bzw. das Lesen der an der Schnittstelle des Mikrocontrollers anliegenden Pegel erfolgt bspw. durch einen Testadapter, der an die Schnittstelle angeschlossen wird. In einem Funktionsblock 16 wird dann der nächste  
5 Testschritt des Testablaufs des Boundary-Scan-Testverfahrens ausgewählt.

Anschließend wird in einem Abfrageblock 17 überprüft, ob  
10 alle Testschritte des Boundary-Scan-Testverfahrens durchlaufen worden sind. Falls nein, werden die Funktionsblöcke 13 bis 17 für den nächsten Testschritt durchlaufen. Falls das Boundary-Scan-Testverfahren vollständig ausgeführt worden ist, wird zum Ende des erfindungsgemäßen Verfahrens in Funktionsblock 18  
15 verzweigt. Der JTAG-Testmodus wird durch Aktivieren des TRST-Ports 3a (vgl. Fig. 1) beendet.

5 11.01.2000  
Robert Bosch GmbH , 70469 Stuttgart

Ansprüche

- 10 1. Verfahren zum Ansteuern eines Mikroprozessors (1), der  
Teil eines Mikrocontrollers ist, im Rahmen eines Boundary-  
Scan-Testverfahrens nach dem IEEE Standard 1149 über eine  
Joint-European-Test-Action-Group (JTAG)-Schnittstelle (2)  
15 des Mikroprozessors (1), **dadurch gekennzeichnet**, dass die  
JTAG-Schnittstelle (2) des Mikroprozessors (1) von einer  
auf dem Mikroprozessor (1) ablauffähigen Testroutine aus  
angesteuert wird.
- 20 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,  
dass IO-Ports des Mikroprozessors (1) mit den Pins (3) der  
JTAG-Schnittstelle (2) verbunden und die Pins (3) der JTAG-  
Schnittstelle (2) von der Testroutine über die IO-Ports  
angesteuert werden.
- 25 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch  
gekennzeichnet, dass die Pins (3) der JTAG-Schnittstelle  
(2) von der Testroutine gemäß eines in der Testroutine  
festgelegten Testablaufs gesetzt und/oder gelesen werden.
- 30 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch  
gekennzeichnet, dass von der Testroutine im Rahmen des  
Boundary-Scan-Testverfahrens ein Testdatenstrom für die  
JTAG-Schnittstelle (2) zur Verfügung gestellt wird.



5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die IO-Ports des Mikroprozessors (1) von der Testroutine für eine vorgegebene Zeitdauer als Output-Ports und auf high geschaltet werden, wobei die an einer Schnittstelle des Mikrocontrollers anliegenden Pegel gemessen werden.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die IO-Ports des Mikroprozessors (1) von der Testroutine für eine vorgegebene Zeitdauer als Input-Ports geschaltet werden, wobei gemäß des festgelegten Testablaufs bestimmte Werte an einer Schnittstelle des Mikrocontrollers angelegt werden.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die an den Pins (3) der JTAG-Schnittstelle (2) anliegenden Werte über die IO-Ports des Mikroprozessors (1) gelesen und in einem Speicherbereich des Mikrocontrollers abgelegt werden.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die in dem Speicherbereich abgelegten Werte über die Schnittstelle des Mikrocontrollers ausgelesen werden.

9. Verwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 8 zur Überprüfung des Mikrocontrollers eines Steuergeräts für ein Kraftfahrzeug.

10. Mikrocontroller mit mindestens einem Mikroprozessor (1), der im Rahmen eines Boundary-Scan-Testverfahrens nach dem IEEE Standard 1149 über eine Joint-European-Test-Action-Group (JTAG)-Schnittstelle (2) des Mikroprozessors (1) ansteuerbar ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass

mindestens ein Mikroprozessor (1) Mittel (4, 5) zum Ansteuern der JTAG-Schnittstelle (2) des Mikroprozessors (1) durch eine auf dem Mikroprozessor (1) ablauffähige Testroutine aufweist.

5

11. Mikrocontroller nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel Padzellen (4a) des Mikroprozessors (1) und Verbindungsleitungen (5) von den Padzellen (4a) zu den Pins (3) der JTAG-Schnittstelle (2) umfassen, wobei die Padzellen (4a) eine Input-Output (IO)-Port-Funktion aufweisen.

10

15

12. Mikrocontroller nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Mikrocontroller eine Schnittstelle aufweist, an der von außerhalb des Mikrocontrollers die anliegenden Pegel messbar bzw. bestimmte Werte anlegbar sind.

20

13. Steuergerät für ein Fahrzeug, welches einen Mikrocontroller nach einem der Ansprüche 10 bis 12 enthält und ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8 durchführt.

11.01.2000

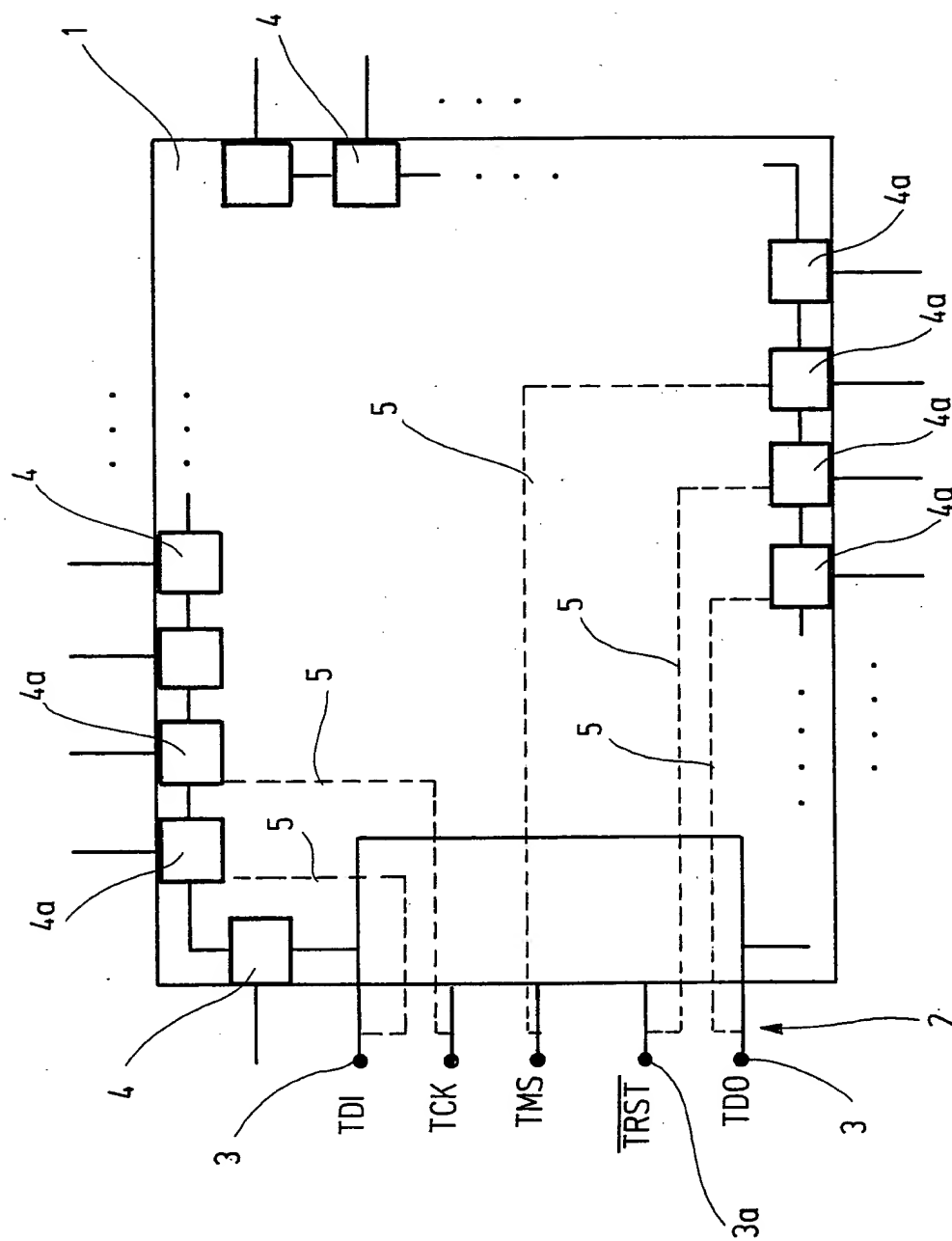
5 Robert Bosch GmbH , 70469 Stuttgart

Verfahren zum Ansteuern einer JTAG-Schnittstelle eines  
Mikroprozessors eines Mikrocontrollers auf dem eine JTAG-  
Schnittstelle implementiert ist und Mikrocontroller

10

Zusammenfassung

15 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ansteuern eines  
Mikroprozessors (1), der Teil eines Mikrocontrollers ist,  
im Rahmen eines Boundary-Scan-Testverfahrens nach dem IEEE  
Standard 1149 über eine Joint-European-Test-Action-Group  
(JTAG)-Schnittstelle (2) des Mikroprozessors (1). Um einen  
20 Mikrocontroller auch dann mit Hilfe des Boundary-Scan-  
Testverfahren testen zu können, wenn die JTAG-Schnittstelle  
(2) für einen separaten Hardware-Adapter eines JTAG-Testers  
nicht zugänglich ist, wird vorgeschlagen, dass die JTAG-  
Schnittstelle (2) des Mikroprozessors (1) von einer auf dem  
Mikroprozessor (1) ablauffähigen Testroutine aus  
25 angesteuert wird.  
(Figur 1)



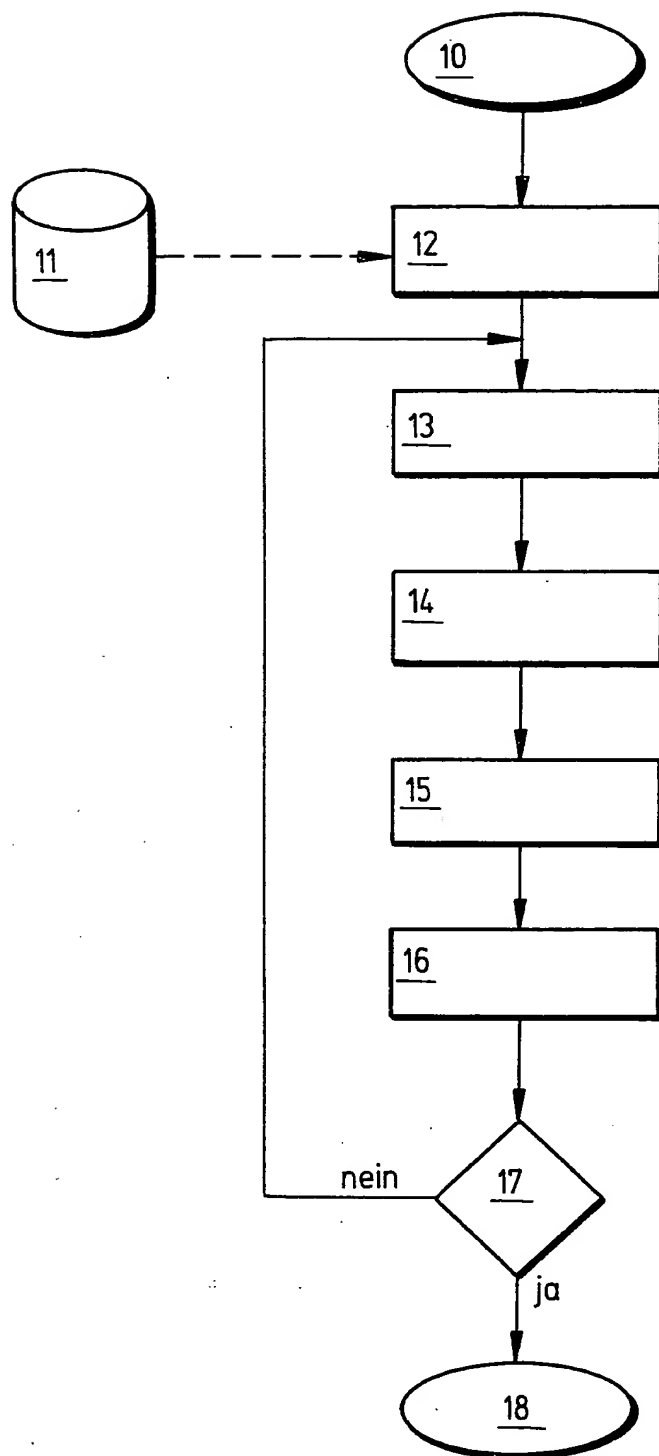


Fig.2